

## 独国HÜBNERグループのフォトニクス及びテラヘルツ関連製品の取り扱いを開始

(株)日本レーザー(本社:東京都新宿区西早稲田 2-14-1、電話 03-5285-0861、社長:近藤宣之)は、独国HÜBNER(ヒューブナー)社の OPO レーザー C-WAVE 及びテラヘルツ関連製品の販売を 2016 年 10 月 1 日から開始した。

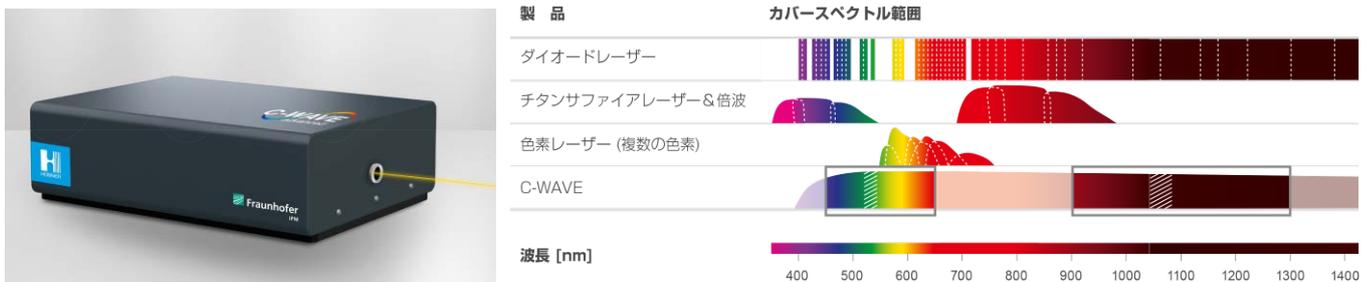
### HÜBNER グループの紹介

HÜBNER グループ(ヒューブナー・グループ [http://www.hubner-group.com/huebner\\_gruppe.html](http://www.hubner-group.com/huebner_gruppe.html))は、鉄道、バス、空港施設、自動車産業など輸送産業向けのソリューションのほか、医療技術、生活支援事業、テラヘルツ技術、フォトニクス、高周波アプリケーションといった多彩な分野に技術と製品を提供している包括的なシステムサプライヤーである。世界各国に 2,400 人以上のスタッフを有する国際的企業でありながら、常に顧客とそのニーズに寄り添い、その優れた革新力とサービスは、70 年以上の長きにわたってユーザーに支持されている。

設立以来、企業文化として確立してきたイノベーションの精神により、200 以上の特許を取得。現在は EU 主催のさまざまな研究プロジェクトに参加している。特に、このたび日本レーザーが取り扱いを開始するテラヘルツ及びフォトニクス技術では、フラウンホーファー IPM など著名な研究機関と緊密に協力し、2014 年には連続可変 OPO レーザー C-WAVE でプリズム賞を受賞している。一方既存製品についても、より高い環境適合性、使い易さの向上や機能の充実など、積極的かつ継続的な改良を行っている。

### Photonics Division : チューナブル OPO レーザー「C-WAVE」

HÜBNER フォトニクス・ディビジョン(<http://www.hubner-photonics.com/>)では、研究または産業用途はもちろんのこと、公共施設でも使用可能な高性能なレーザーシステムを開発・製造している。本ディビジョンの OPO レーザー C-WAVE は、2014 年に業界最高の賞の一つであるプリズム賞を受賞している。



C-WAVE は可視域から近赤外までの広いスペクトル領域をカバーするチューナブルな CW 光パラメトリックオシレーション (OPO) 光源。完全コンピュータ制御で、コンポーネントの交換無しで波長チューニングできる、柔軟性に優れた使い易い光源である。イントラキャビティ SHG 付きの OPO 構成で、標準の波長域は 450~650 nm であるが、他の波長域も提供可能である。

LD、色素、チタンサファイアといった従来の波長可変レーザーの代替として、広いスペクトル領域と簡単な波長選択機能を有する汎用タイプの C-WAVE basic と、原子物理や量子光学など要件の厳しい用途向けに開発された、単一周波数発振、狭線幅の C-WAVE advanced の 2 シリーズを展開。またそれぞれ必要な出力パワーレベルに応じて、外部単一周波数レーザーによる励起か、操作と適用がより簡易なポンプレーザー内蔵タイプを選択できる。

## Terahertz Technology Division : テラヘルツ分光関連装置

HÜBNER テラヘルツ技術ディビジョン(<http://www.hubner-terahertz.com/>)では、テラヘルツ技術を用いて公共の利益に大きく貢献する新しい非破壊検査を開発している。本ディビジョンで開発・製造している新しいテラヘルツスキャナは、隠された有害物質、薬物、爆発物を検出・可視化するものである。X線による技術と異なり、ユーザーの健康リスクがなく安全。シンプル、直感的な操作方法と、高いモバイル性から、どんな場所にも導入が容易である。



### テラヘルツ・イメージング装置「T-SENSE」

- 封書から小包まで、中の有害物質を精密・安全・効果的に可視化
- 非常に高感度で、粉体や接着剤も検知可能
- T-COGNITION との併用で、物質同定も可能

### テラヘルツ分光解析装置「T-COGNITION」

- 封書や小包の中に隠された有害物質を正確に、わずか数秒以内で同定
- ユーザーの要件に応じて出力パラメータ変更可能
- 多様な有害物質データを認識可能：薬物中の物質の同定にも有用

### テラヘルツ分光検査装置「T-SPECTRALYZER」

- 日常的なルーチンの計測・分析に好適な、低コスト&モバイル・テラヘルツ分光検査装置
- 周波数範囲 0.1~4.0 THz、最大ダイナミックレンジ 70 dB
- サンプルを数秒以内で非破壊・非接触分析

### ファイバカップル・テラヘルツ分光検査装置「T-SPECTRALYZER F」

- プラグ&プレイの簡易操作
- 周波数範囲 0.1~2.5 THz、最大ダイナミックレンジ 54 dB
- わずか 0.05 秒でサンプルを非破壊・非接触検査

以上

#### 株式会社 日本レーザー

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-14-1 URL <http://www.japanlaser.co.jp/>

#### 本リリース製品の営業担当者

#### 営業本部

電話 03-5285-0861 FAX 03-5285-0860 E-Mail : [jlc@japanlaser.co.jp](mailto:jlc@japanlaser.co.jp)

#### 本リリースについてのお問合せ

#### 販促業務部

橋本 和世

電話 03-5285-0861 FAX 03-5285-0860 E-Mail : [hashimoto@japanlaser.co.jp](mailto:hashimoto@japanlaser.co.jp)